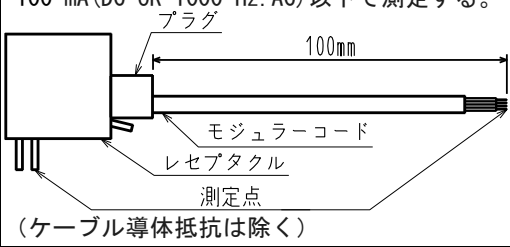


適用規格		TIA/EIA-568-B.2 カテゴリ-5e			
定格	使用温度範囲	① -25℃ ~ 60℃ ②	保存温度範囲	-25℃ ~ 60℃ ②	
	電圧	AC 125V		電流	1 A
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外觀, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz. AC) 以下で測定する。  (ケーブル導体抵抗は除く)	50 mΩ以下	○	○
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	100 MΩ以上	○	○
	耐電圧(端子間)	AC 500 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	近端漏話減衰量	100 MHzでの各ペア間の特性を測定する。 パッチコードテスト 0.5 m	35.28dB以上	○	-
機械的性能	繰り返し動作	200回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 70 mΩ以下 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 毎分1オクターブを1サイクルとして 3方向各10サイクル試験する。	① 5 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各3回試験する。②		○	-
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40℃, 湿度 90 ~ 95%中に 500時間放置する。	①接触抵抗: 70 mΩ以下 ②絶縁抵抗: 1 MΩ以上(高湿時) 10 MΩ以上(乾燥時) ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	温度サイクル	温度 -55±3 → 5~35 → 85±2 → 5~35℃ 時間 30~35 → 5以内 → 30~35 → 5以内分 を5サイクル試験する。	①接触抵抗: 70 mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	塩水噴霧	濃度 5%の塩水, 48時間放置する。	①接触抵抗: 70 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	-
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	② 3	DIS-E-00005527	KIM JAEHYEON	KG. OKITA	20210615
備考	① 使用温度範囲は通電による温度上昇も含まれます。			承認	HO. MIWA 20050825
				検図	YH. ENAMI 20050825
				担当	SS. SATOH 20050825
				製図	SS. SATOH 20050825
注	QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC-125383-00-00	
HRS	製品規格表		製品名	TM21DP-TM-88P	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0222-2941-3-00	② 1/1